

技術
セミナー

X線吸収分光法 基礎研修

2026
8/27 (木)
28 (金)

会場

TOIC NAGOYA

あいちシンクロトロン光センター

ビームライン BL5S1

参加費

無料 (旅費等は自己負担)

X線吸収微細構造 (XAFS) は、試料に照射するX線のエネルギーを走査した際に得られる吸収スペクトルの微細な構造を解析することで、注目する元素の配位数、分子対称性、原子間距離、および酸化状態といった局所的な構造情報を得ることができる手法です。本手法は、結晶構造の有無や純物質・混合物を問わず、非晶質 (アモルファス) や液体、岩石、土壌、生物、半導体、触媒反応中のその場観察 (in-situ/operando) など、広範な試料形態に対応可能です。その汎用性の高さから、現代の化学・材料研究において極めて強力なツールとなっています。

本講習会は、特にこれから放射光施設での測定を検討されている方や、ラボ機での分析に限界を感じている方を対象として開催いたします。シンクロトロン光を利用したXAFS測定がもたらす圧倒的な情報量と、ラボ型装置では困難な微量分析・迅速測定のメリット、さらには解析の基礎から実例までを体系的に学ぶことを目的としています。

スケジュール

8/27 木 13:30~17:00 @TOIC NAGOYA

13:30 - 13:40 趣旨説明・講師紹介等

13:40 - 15:40 座学 ※ハイブリッド開催

16:00 - 17:00 名大コアファシリティ視察 (現地参加者 希望者のみ)

18:00 - 20:00 懇親会 (現地参加者 希望者のみ)

8/28 金 9:30~18:30 @あいちシンクロトロン光センター BL5S1

9:00 - 9:15 集合

9:15 - 9:50 オリエンテーション

10:00 - 18:30 硬X線XAFS実習

参加人数

いずれも先着順

8/27-28 両日現地参加 最大5名

8/27 座学へのハイブリッド参加 最大100名

技術職員、研究者、学生等XAFSに興味・関心がある方はどなたでも参加可能です

申し込み

下記URLまたは右の二次元バーコードより、必要事項をご記入の上お申し込みください。

<https://forms.cloud.microsoft/r/hAVWgSsjdt>



世話人

高濱謙太郎 (東海国立大学機構)、下田周平 (北海道大学)、村上達也 (北陸先端科学技術大学院大学)、杉山博則 (金沢大学)

講師

早稲田大学
教育・総合科学学術院
東京理科大学 先進工学部



中尾 愛子 博士

民間企業勤務を経て、理化学研究所にてX線光電子分光法の専門技術者として勤務。2000年の博士号取得後は、研究員として定年まで勤め上げた。その間、科学技術振興調整費プロジェクト研究員やJST CREST研究員などを歴任。現在は非常勤講師を務め、長年の経験と研鑽により培ったX線分光分析を中心とする表面分析の専門技術を活かし、研究・研究支援や技術教育の分野で高い成果をあげている。

主催 東海国立大学機構 イノベーションコアファシリティセンター

共催 XPSコミュニティ、文部科学省共同利用・共同研究拠点「触媒科学計測共同研究拠点」

後援 あいちシンクロトロン光センター、名古屋大学シンクロトロン光研究センター、大学連携研究設備ネットワーク、文部科学省 マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM 名古屋大学)